ГОРЕНИЕ, ВЗРЫВ И УДАРНЫЕ ВОЛНЫ

УДК 533.9 : 533.08

РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ РЕГИСТРАЦИИ ИНТЕНСИВНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ ГАЗОВ ЗА ФРОНТОМ СИЛЬНЫХ УДАРНЫХ ВОЛН

© 2021 г. П. В. Козлов¹, И. Е. Забелинский¹, Н. Г. Быкова¹, Ю. В. Акимов¹, В. Ю. Левашов^{1*}, Г. Я. Герасимов¹, А. М. Тереза²

¹Научно-исследовательский институт механики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

²Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семёнова Российской академии наук, Москва, Россия *E-mail: vyl69@mail.r; levashovvy@imec.msu.ru Поступила в редакцию 08.02.2021; после доработки 19.02.2021; принята в печать 22.02.2021

Представлена методика калибровки системы регистрации излучения газов за фронтом ударной волны на экспериментальном комплексе "Ударная труба" НИИ механики МГУ в спектральном диапазоне 190–1100 нм. Основное внимание уделяется вопросу получения измеряемых величин в абсолютных единицах. Описана процедура калибровки измерительной системы при помощи эталонных источников излучения. Показано, что только совместное использование данных панорамного спектра с результатами временных эволюций излучения в узком спектральном диапазоне получить корректную информацию о плотности мощности излучения компонент плазмы в ударной волне.

Ключевые слова: ударные волны, излучение газов, калибровка оптической системы, спектроскопия атомов и молекул, вакуумное ультрафиолетовое излучение, видимая область спектра. **DOI:** 10.31857/S0207401X21080069

введение

Изучение процессов в газах, нагретых до высоких температур, неразрывно связано с развитием методов исследования быстропротекающих процессов, в том числе спектроскопических методов исследований [1–3]. Изучение спектрального распределения и его временной эволюции может дать интересную информацию о различных процессах, протекающих в газе [2, 4–8]. Измерение этих характеристик с высокой разрешающей способностью (до 10 нс в экспериментах по измерению временной эволюции) позволяет разделять стадийное поведение происходящих процессов [9]. При этом можно детально исследовать как равновесную, так и неравновесную область такого рода процессов. Уникальным инструментом для изучения высокотемпературных процессов в плазме при высоких температурах (более 50000 градусов) в различных газах (воздух, кислород, азот, окись азота, аргон, углекислый газ, окись углерода) является ударная труба [4, 10, 11].

Важность исследования процессов в высокотемпературных газовых средах связана с развитием космической техники, освоением космического пространства, разработкой летательных аппаратов, движущихся в атмосфере планет с высокими скоростями. Обтекание космического аппарата при движении в воздухе с высокими скоростями сопровождается образованием вокруг него низкотемпературной плазмы, где могут протекать сложные физико-химические процессы. К данным процессам можно отнести обмен энергией между поступательной, вращательной, колебательной и электронной степенями свободы, газофазные и гетерогенные химические реакции, вдув продуктов разрушения теплозащитного покрытия, излучение. Для описания такого рода явлений необходимы разработка соответствующих моделей и методик, подбор параметров моделей, а также их валидация. Помимо процессов, указанных выше, необходимо отметить, что увеличение скорости набегающего потока приводит к увеличению радиационной составляющей теплового потока к поверхности аппарата [12-15].

Регистрация панорамных спектров излучения ударных волн в видимом и ультрафиолетовом диапазонах в настоящее время осуществляется с помощью спектрометров, использующих в качестве приемного устройства приборы с зарядовой связью (ПЗС) или приборы с зарядовой связью с электрооптическим преобразователем (ПЗС с ЭОП).



Рис. 1. Схема системы регистрации ударной трубы: *1*–*4* – зеркала, ФЭУ – фотоэлектронный умножитель, ПК – персональный компьютер, ПЭ – прибор с зарядовой связью с электрооптическим преобразователем.

В настоящей работе представлена методика регистрации интегрального распределения интенсивности излучения ударной воны в широком спектральном диапазоне: 190—1100 нм. При этом основное внимание при описании методики уделяется вопросу получения данных в абсолютных единицах.

МЕТОДИКА РЕГИСТРАЦИИ СПЕКТРАЛЬНЫХ И ВРЕМЕННЫ́Х ХАРАКТЕРИСТИК ИЗЛУЧЕНИЯ УДАРНО-НАГРЕТЫХ ГАЗОВ

Система регистрации экспериментального комплекса "Ударная труба" НИИ механики МГУ [16] позволяет регистрировать как интегральное (суммарное) излучение ударной волны, проходящей мимо измерительного сечения, так и наблюдать эволюцию во времени излучения на узком участке спектра с высоким временным и спектральным разрешением. Диапазон регистрируемого излучения находится в интервале длин волн от 190 до 1100 нм.

ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА том 40 № 8 2021

При регистрации панорамного спектра излучения ударной волны обычно используются спектрометры, в которых в качестве приемника излучения служат ПЗС-линейки или матрицы. В настоящее время минимальное время экспозиции, реализуемое на таких устройствах, больше времени прохождения ударной волны в измерительном сечении (особенно при высоких скоростях ударной волны), а следовательно, регистрируемое ими излучение представляет собой интегральный по времени спектр. Регистрация временной эволюции излучения возможна только с помощью фотоэлектронных умножителей (ФЭУ), обеспечивающих достаточную чувствительность при высоком временном разрешении. Обычно с помощью ФЭУ исследуют временные изменения излучения в узком спектральном диапазоне, который выделяют с помощью монохроматора. Схема системы регистрации представлена на рис. 1.

Для получения значений интенсивности в абсолютных единицах необходимо провести процедуру предварительной калибровки регистрирующей системы. На рис. 2 приведена эквивалентная оптическая схема измерения. В такой схеме изображение источника излучения на входной щели спектрометра строится в масштабе 1 : 1.

Калибровка ПЗС-приемника и ФЭУ в видимом и ультрафиолетовом диапазонах 190—1100 нм осуществляется с помощью вторичных эталонов энергетической яркости, в качестве которых используются лампы с вольфрамовой нитью накала (вольфрамовая лампа) и дейтериевая лампа. В вольфрамовых лампах СИРШ-8 и СИ-10 нить накала имеет ширину 2 и 3 мм и высоту 10 и 20 мм соответственно.

Вольфрамовые лампы проходят периодическую поверку на спектральную энергетическую яркость (СПЭЯ) или на яркостную температуру [17] в институтах службы метрологии. Она представляет собой мощность, излучаемую источником по нормали к поверхности с единицы площади в единичный телесный угол в единичном спектральном диапазоне. В системе СИ СПЭЯ выражается в Вт/м³ · ср, но более понятными единицами измерения являются Вт/см² · ср · мкм. При калибровке лампы на СПЭЯ определяется яркость излучения на нескольких длинах волн при заданной величине тока накала.

Возможна также калибровка эталонной лампы на величину яркостной температуры, в результате которой выдается сертификат на соответствие набора значений яркостных температур набору величин тока накала. Яркостную температуру определяют на определенной длине волны (обычно $\lambda = 659$ нм). Неудобство данного метода калибровки вольфрамовых ламп состоит в том, что для получения СПЭЯ нужно провести определенные расчеты. Для этого на первом этапе необходимо установить соответствие яркостной температуры T_я истинной температуре Т вольфрама с учетом зависимости степени черноты вольфрама, є, от длины волны λ и истинной температуры: $\varepsilon(\lambda, T)$. Для этих целей используется следующее соотношение [18]:

$$\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{\rm q}} = \frac{\lambda k}{ch} \ln\left(\varepsilon(\lambda, T)\right),\tag{1}$$

где λ — длина волны, k — постоянная Больцмана, c — скорость света, h — постоянная Планка. Результаты таких расчетов на длине волны λ = 659 нм представлены в табл. 1.

Далее для любого значения яркостной температуры спектральная энергетическая яркость вольфрамовой лампы рассчитывается с использованием формулы Планка с учетом степени черноты вольфрама $\varepsilon(\lambda, T)$:

$$b_{\lambda} = \varepsilon(\lambda, T) \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{\exp(hc/\lambda kT) - 1}.$$
 (2)



Рис. 2. Эквивалентная оптическая схема измерения излучения ударной волны: T - сечение ударной трубы, <math>L - линза с фокусным расстоянием f, D - ограничивающая диафрагма, SP - спектрометр, <math>1 -кварцевые окошки в измерительной секции.

На рис. За приведен пример СПЭЯ вольфрамовой лампы для яркостной температуры, равной 2200°С. Как видно из этого рисунка, использование вольфрамовых ламп в качестве эталонного источника имеет некоторые ограничения. Поскольку излучение вольфрама с падением температуры ниже 3000 К резко падает на длинах волн ниже 400 нм (рис. За), то использование вольфрамовых ламп ограничено диапазоном длин волн не ниже 300 нм (т.е. $\lambda \ge 300$ нм). Для калибровки оптических систем в диапазоне $\lambda < 300$ нм используют дейтериевую лампу [19].

Спектр излучения дейтериевой лампы в относительных единицах представлен на рис. 36. Абсолютное значение СПЭЯ дейтериевой лампы получают путем сравнения ее излучения с излучением вольфрамовой лампы в общем спектральном диапазоне (300–400 нм). В результате такого сравнения может быть получен коэффициент пе-

Таблица 1. Значения истинной температуры (*I*) для различных яркостных температур (*T*_a)

, , , 1	L · · ·	
$T_{\mathfrak{g}}, {}^{\circ}\mathrm{C}$	<i>Т</i> , К	δ <i>Τ</i> , Κ
1200	1550	±2
1300	1661	± 2
1400	1774	± 2
1500	1887	± 2
1600	2002	± 2
1700	2117	± 2
1800	2234	± 2
1900	2351	± 3
2000	2470	± 3
2100	2590	± 3
2200	2712	± 4
2300	2834	± 4

ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА том 40 № 8 2021



Рис. 3. Спектральные плотности энергетической яркости лампы СИ-10 для яркостной температуры 2200°С (*a*) и лампы ДДС-30 (*б*).

ресчета, который далее применяется в более коротковолновом диапазоне.

После того как определены СПЭЯ эталонных источников, осуществляется калибровка измерительной (оптической) схемы эксперимента. Эксперимент калибровки состоит в том, что в измерительную схему на место исследуемого источника помещается эталонный источник излучения. В комплексе "Ударная труба" используется схема измерения, приведенная на рис. 2. В этой схеме источник излучения располагается на расстоянии 2f от фокусирующей линзы, которая, в свою очередь, отстоит на расстоянии 2f от входной щели спектрометра; таким образом, коэффициент увеличения схемы равен единице.

В эксперименте по калибровке оптической схемы энергия от эталонного источника ($P_{\rm эт}(\lambda)$), поступающая на приемник за время экспозиции ($\tau_{\rm калибр}$), может быть рассчитана следующим образом:

ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА том 40 № 8 2021

$$P_{\rm PT}(\lambda) = b_{\lambda} \tau_{\rm KAJIM \delta p} \left[\Box \mathscr{K} / \left(\mathsf{M}^3 \cdot \mathsf{cp} \right) \right]. \tag{3}$$

В то же время приемник излучения измеряет эту величину в условных единицах ($I_{\Pi 3C}(\lambda)$, ед. отсч.). Пример спектров излучения вольфрамовой лампы СИ-10 и дейтериевой лампы ДДС-30, зарегистрированных за время экспозиции 10 мкс приемником излучения, представлен на рис. 4*a*.

Функция чувствительности оптической схемы $F(\lambda)$ определяется как отношение измеренного приемником сигнала, ($I_{\Pi 3C}(\lambda)$ [ед. отсч.]), к энергии эталонного источника, $P_{T}(\lambda)$:

$$F(\lambda) = \frac{I_{\Pi 3C}(\lambda)}{P_{\mathfrak{I}}(\lambda)} \left[\frac{e_{\mathcal{I}.OTC \mathfrak{Y}. \cdot \mathfrak{M}^{3} \cdot cp}}{\Im \mathfrak{M}} \right].$$
(4)

Пример функции чувствительности $F(\lambda)$ в интервале длин волн 200—600 нм представлен на рис. 46.

В эксперименте с ударной волной наблюдаемый в условных единицах $I_{\Pi 3C}^{y_B}(\lambda)$ спектр излуче-



Рис. 4. Спектры излучения эталонных источников, зарегистрированные спектрометром Horiba CP140-1824, при времени экспозиции 10 мкс (*a*) и функция чувствительности оптической схемы (*б*); *1* – дейтериевая лампа ДДС-30, *2* – вольфрамовая лампа СИ-10.

ния переводится в абсолютные энергетические единицы путем деления его интенсивности на функцию чувствительности $F(\lambda)$:

$$P_{\rm YB} = I_{\Pi 3C}^{\rm YB} / F(\lambda) = P_{\rm pT} I_{\Pi 3C}^{\rm YB} / I_{\Pi 3C}.$$
 (5)

Переход к единицам объемной плотности энергии излучения осуществляется путем деления $P_{\rm YB}$ на диаметр ударной трубы в предположении, что ударная волна вдоль оптической оси наблюдения однородна.

Пример спектра излучения воздуха в абсолютных единицах для различных скоростей ударной волны представлен на рис. 5. Данный рисунок получен с использованием методики, представленной выше.

Необходимо отметить, что вид наблюдаемого спектра, а именно соотношение между максимальными значениями различных компонент спектра, зависит в том числе и от ширины аппаратной функции спектрометра. Особенно сильно такая зависимость проявляется при регистрации линейчатого спектра излучения атомов в силу того, что ширина аппаратной функции спектрометра обычно значительно превышает физическую ширину атомарной линии излучения. В значительно меньшей степени это проявляется при ре-

ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА том 40 № 8 2021



Рис. 5. Спектральная плотность энергии излучения ударной волны в воздухе при начальном давлении $P_1 = 0.25$ Торр и различных скоростях ударной волны V_{SW} , км/с: 1 - 7.7, 2 - 9.1, 3 - 10.0, 4 - 10.6, 5 - 11.4.

гистрации молекулярных полос излучения и не имеет никакого влияния на плавно меняющуюся при изменении длины волны фоновую составляющую спектра.

Для перехода к объемной мощности излучения ударной волны необходимо учитывать тот факт, что в эксперименте время экспозиции спектрометра значительно превышает время излучения ударной волны, поэтому для корректного определения мощности излучения необходимы исследования временны́х характеристик излучения с достаточным (наносекундным) разрешением.

Проведение таких исследований возможно только на отдельных длинах волн с использованием ФЭУ в качестве приемника излучения. Излучение на определенной длине волны выделяют с помощью монохроматора. В экспериментах на установке "Ударная труба" возможно получение в одном эксперименте данных о временной эволюции излучения на трех длинах волн, а также панорамного спектра.

На рис. 6 приведены осциллограммы излучения ударной волны в воздухе для двух ее скоростей: 8.22 и 10 км/с, на нескольких длинах волн — 213, 391 и 420 нм, принадлежащих излучению разных компонент плазмы. Данные зарегистрированы с помощью монохроматора Horiba 1061 и $\Phi \Im Y$ R446 (Hamamatsu) в качестве приемника излучения. Для определения эффективного времени излучения ударной волны в выделенном узком диапазоне спектра ($\Delta \tau$) используется следующий подход.

Временну́ю осциллограмму излучения, наблюдаемую в эксперименте, заменяют равным ей по площади прямоугольником, высота которого равна значению мощности излучения в максимуме. При этом ширина прямоугольника равна эффективному времени излучения ударной волны.

Из данных, представленных на рис. 6, следует, что для ударной волны в воздухе время $\Delta \tau$ для разных компонент плазмы и разных скоростей волны изменяется от 0.24 до 1.7 мкс. Таким образом, использование одного значения времени излучения $\Delta \tau$ для всего спектрального диапазона может приводить к некорректным данным по мощности излучения. Именно совместное использование данных панорамного спектра с результатами временны́х исследований может дать правильную информацию о плотности мощности излучения различных компонент плазмы ударной волны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе описана методика регистрации излучения ударно-нагретого высокотемпературного газа. Для получения экспериментальной информации в абсолютных единицах необходима предварительная калибровка измерительной системы. Для рассматриваемого в работе диапазона длин волн (190–1100 нм) в качестве эталонного источника излучения используются вольфрамовые и дейтериевые лампы. Отмечается, что при экспериментальном определении объемной мощности излучения необходимо учитывать тот факт, что



Puc. 6. Временны́е нормированные профили излучения ударно-нагретого воздуха: $a - V_{yB} = 8.22$ км/с, $1 - \lambda = 213$ нм, Δ $\tau = 0.24$ мкс, $2 - \lambda = 391$ нм, $\Delta \tau = 1.10$ мкс; $\delta - V_{yB} = 10$ км/с, $P_0 = 0.25$ Topp, $3 - \lambda = 420$ нм, $\Delta \tau = 1.71$ мкс, $4 - \lambda = 213$ нм, $\Delta \tau = 0.46$ мкс.

время экспозиции измерительного оборудования значительно превышает время излучения ударной волны. В этой связи для корректного определения мощности излучения необходимы исследования временны́х характеристик излучения с достаточным (наносекундным) разрешением.

Работа выполнена в рамках научного плана Института механики МГУ (№ АААА-А19-119012990112-4) при поддержке Российским фондом фундаментальных исследований (грант № 20-08-00343).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Streicher J.W., Krish A., Hanson R.K. // AIAA Scitech 2020 Forum. 2020. V. 1. Pt. F. P. 1.

- 2. Левашов В.Ю., Козлов П.В., Быкова Н.Г., Забелинский И.Е. // Хим. физика. 2021. Т. 40. № 1. С. 16
- Быкова Н.Г., Забелинский И.Е., Ибрагимова Л.Б., Шаталов О.П. // Оптика и спектроскопия. 2008. Т. 105. № 5. С. 732.
- 4. Ступоченко Е.В., Лосев С.А., Осипов А.И. Релаксационные процессы в ударных волнах. М.: Наука, 1965.
- 5. *Ибрагимова Л.Б., Кузнецова Л.А.* // Хим. физика. 2004. Т. 23. № 5. С. 82.
- 6. Быкова Н.Г., Забелинский И.Е., Ибрагимова Л.Б. и др. // Хим. физика. 2018. Т. 37. № 2. С. 35.
- 7. Ибрагимова Л.Б., Левашов В.Ю., Сергиевская А.Л., Шаталов О.П. // Изв. РАН. МЖГ. 2014. № 1. С. 131.
- 8. *Ibraguimova L.B., Sergievskaya A.L., Levashov V.Y. et al.* // J. Chem. Phys. 2013. V. 139. № 3. P. 034317.

ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА том 40 № 8 2021

- 9. Cruden B.A., Brandis A.M. // AIAA Paper. 2019. № 2019–3359.
- Козлов П.В. Лосев С.А. Энцикл. низкотемп. плазмы. Т. 2 / Под ред. Фортова Е.В. М.: Наука, 2000. С. 363.
- 11. *Минцев В.Б., Фортов В.Е.* // Теплофизика высоких температур. 1982. Т. 20. № 4. С. 745.
- Белоцерковский О.М., Биберман Л.М., Бронин С.Я., Лагарьков А.Н., Фомин В.Н. // Там же. 1969. Т. 7. № 3. С. 529.
- 13. Wei H., Morgan R.G., Mcintyre T.J., Brandis A.M., Johnston C.O. // AIAA Paper. 2017. № 2017-4531.
- Johnston C.O. Brandis A.M. // J. Spacecr. Rockets. 2015. V. 52. № 1. P. 105.

- 15. Surzhikov S. // AIAA Paper. 2013. № 2013-0606.
- Акимов Ю.В., Быкова Н.Г., Забелинский И.Е., Козлов П.В., Левашов В.Ю. Экспериментальный комплекс "Ударная труба"; https://istina.msu.ru/equipment/card/279166300/
- Лебедева В.В. Техника оптической спектроскопии. М.: Изд.-во МГУ, 1986.
- 18. Малышев В. И. Введение в экспериментальную спектроскопию. М.: Наука, 1979.
- Hamamatsu deuterium lamps D2 LAMPS. 2020; https://www.hamamatsu.com/resources/pdf/etd/ D2lamps_TLS1017E.pdf